

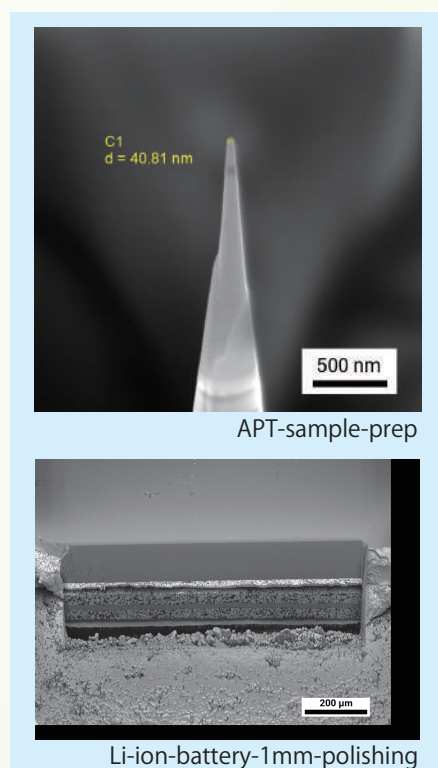
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 NIMS 微細構造解析プラットフォーム 地域セミナー

XeプラズマFIBを用いた試料作製と FIB-SEMを軸とした他の分析法との融合

Xe プラズマ FIB-SEM は、最大 1mm までの高速加工だけでなく、その不活性な性質により Ga フリーの試料作製が可能で、年々ニーズが高まっています。また ToF-SIMS やラマン顕微鏡の FIB-SEM への搭載による応用も展開されています。

本講演ではこれらの詳細と応用例について紹介します。ご興味のある方はぜひ参加登録の上、ご参加ください。

※ 当日参加も可能ですが、準備の都合上、下記Webサイトから事前登録にご協力下さい。



日時

2020年 4月 6日 (月)

13:30～14:40 (受付 13:00～)

場所

国立研究開発法人 物質・材料研究機構
千現地区 第2会議室

入場無料

※事前登録
4/2 正午まで

講演者

株式会社東陽テクニカ
ライフサイエンス&マテリアルズ 鈴木 直久 氏

参加申込用



QRコード

お問い合わせ

NIMS微細構造解析プラットフォーム事務局

Email: nmcp@nims.go.jp

Tel: 029-859-2310 <https://www.nims.go.jp/nmcp/>

●主催 NIMS微細構造解析プラットフォーム ●共催 電子顕微鏡ステーション